

OSK 75DU EASY-V シリーズ 比表面積およびポロシメトリ

OSK 75DU EASY-V シリーズEASY-Vシリーズは、比表面積試験と細孔径分析に静的体積法を採用した CIQTEK社の製品です。

高精度のデジタル圧力測定およびデータ収集システム、強力な抗干渉能力、高い拡張性、セクションごとに測定されるマルチレンジ圧力センサーにより、低圧測定にお

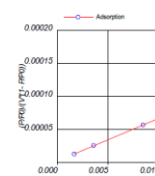
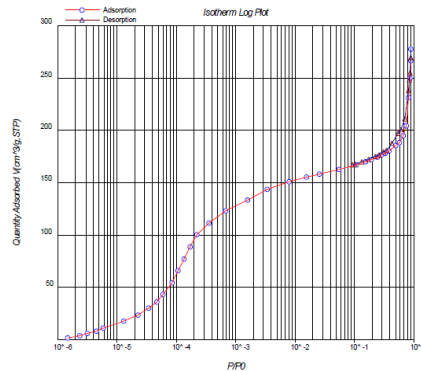
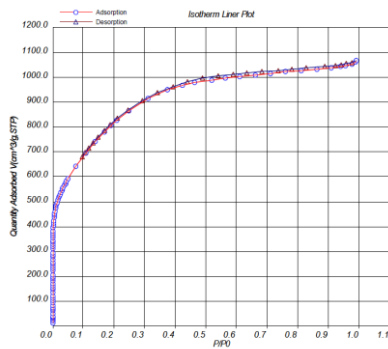


OSK 75DU EA

特長

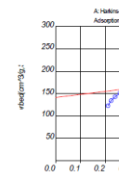
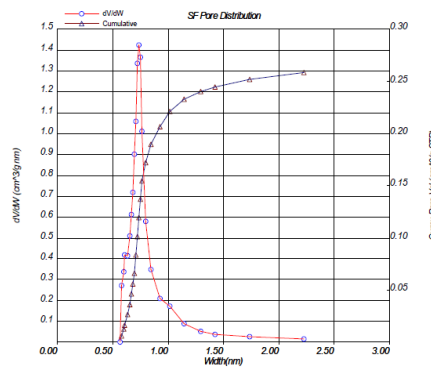
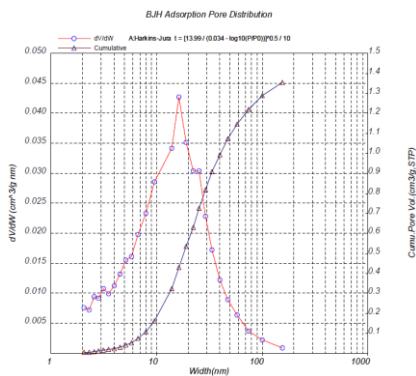
- 10 インチタッチ スクリーン
- 4Lステンレス製インナーデュワー瓶
- 比表面積テストに最適なP₀チューブ
- ボールネジ型昇降システム
- 安全保護扉

分析レポート



BET Tabular Report

PIPO	Quantity Adsorbed (cm³/g STP)
0.02719435961	157.76228552333
0.016779335301	154.86473785499
0.008437109392	150.262963364831
0.003810806263	142.822888140210
0.001895877048	132.941978342067
Slope	
Intercept	
0.008443729611	0.00002055873
R	Multi BET Area
0.999997520815	675.24374200796




BET Tabular Report

PIPO	Ad
0.368203	
0.316149	
0.265664	
0.213884	
0.166610	
0.118246	
Slope	
Intercept	
07.246583	141.238436

仕様

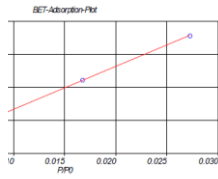
型番	OSK 75DU EASY-V 1220/1440	OSK 75DU EASY-V
検査数	2 / 4	
比表面積範囲	N 2 , CO 2 , Ar, Kr , etc.	
テストガス	比表面積 0.0005 m ² /g 及びそれ以上; 比表面積再現性 ≤ ± 1.0% ≤ ± 1.0%	比表面積 0.0005 m ² /g 比表面積再現性 ≤ ± 1.0%
孔径範囲	孔径: 2 nm-500 nm (メソ孔 とマクロ孔)	孔径: 0.35 μm (ミクロ多孔質と 最も再現性の高い紙)
p/p 0 圧力比	10 ⁻⁴ ~0.998	10 ⁻⁷ ~
圧力センサー	3 Bar	3 Bar、1To
真空システム	メカニカルポンプ到達真空度0.2 Pa	メカニカルポンプの 分子ポンプの到達
パイプライン機構	ステンレス鋼マイクロ溶接真空パイプラインシス	
前処理ステーション	2 / 4	
脱気温度	室温~400℃	


オガワ精機株式会社 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
 Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

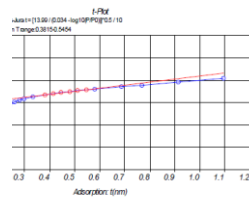
\



SY V シリーズ



#	(P/P0)/(1-P/P0)	Single point BET
3	0.000117574049	667.519698063881
9	0.000110197356	662.735946511918
1	0.00005626728	648.497957295306
0	0.000025373324	619.388614532934
7	0.00012778191	577.646507651644
Volum#		C Value
155.142130235603		3135.303354967590
Langmuir Area		Pressure Curve
6	895.440114469553	



Scrubbed Thickness(mm)	Quantity Adsorbed(mg/g)		
0.645420	177.706696		
0.511783	175.778890		
0.479530	173.640375		
0.446538	171.481983		
0.415083	169.244995		
0.381504	166.879993		
C	Micro Area(mg/g)	Micro Area(m ² /g)	Internal Area(m ² /g)
0.966767	0.218533	571.226695	104.817030

3210/3220/3440

2 /g 及びそれ以上;
性 ≤ ± 1.0%

nm-500 nm;
マクロ多孔質)
孔径サイズの偏差 ≤
nm

0.998

rr、0.1Torr

到達真空度 0.2 Pa
真空度 10⁻⁸ Pa

テム

都新宿区大久保2-2-9
AX : 03-3200-0373
ic2@dune.ocn.ne.jp
ver. 1.0 2023/9/22